Search Notes				

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/629,336	KIM ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Tuan H. Nauven	2813	

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
257	updated	6/5/2006	TN	
,				
		-		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
		<del> </del>		
	1	· -		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR
•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		:
		1